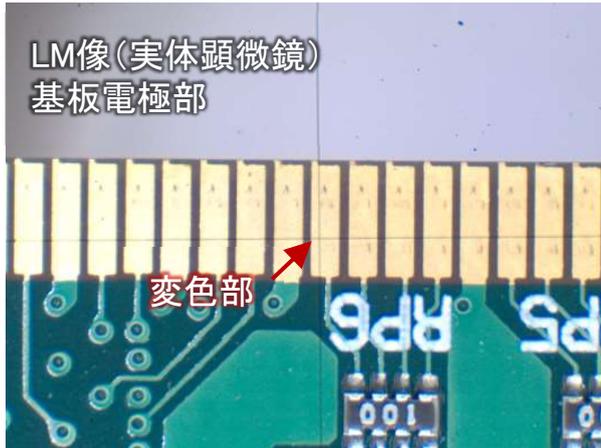


金メッキ電極上の変色分析

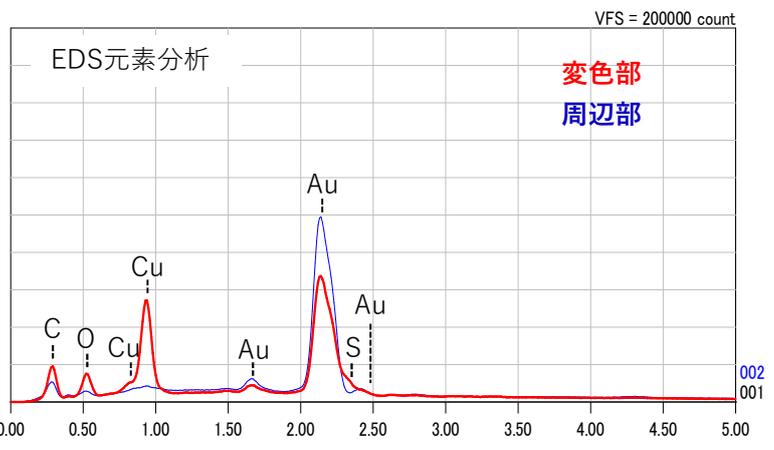
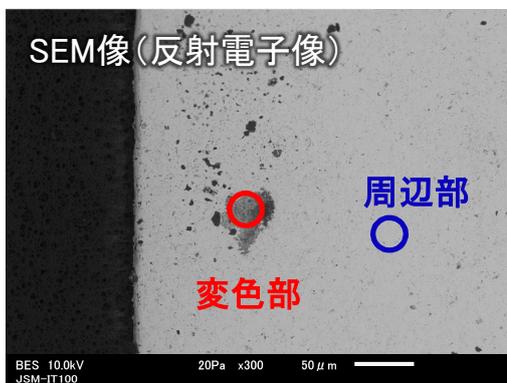
関連製品: 走査電子顕微鏡(SEM)

カードエッジ基板は類似した電極が並んでいるため、光学顕微鏡(LM 実体顕微鏡)で見つけた変色部と同一視野をSEMで探ることが困難です。CLEMで変色部の光学像とSEM像を重ね合わせることで、確実に変色部を特定し、色と組成の関係を素早く評価することができます



光学顕微鏡像連動ソフトウェア*を用いて、変色部とSEM像を一致させ、拡大して観察します

*光学顕微鏡像連動ソフトウェア
SEM操作画面上のSEMライブ像にあらかじめ取得してあったLM像を重ね合わせるソフトウェアです



光学顕微鏡(実体顕微鏡)で検出した金メッキ電極上の変色部をEDS分析した結果、変色部にSとCuの偏在を確認しました

